

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】令和 3 年 11 月 11 日 (2021.11.11)

【公開番号】特開 2021-74134 (P2021-74134A)

【公開日】令和 3 年 5 月 20 日 (2021.5.20)

【年通号数】公開・登録公報 2021-023

【出願番号】特願 2019-201912 (P2019-201912)

【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

A 6 3 F 7/02 3 2 0

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 9 月 28 日 (2021.9.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

主制御部と、

前記主制御部に接続された払出制御部と、

前記主制御部又は前記払出制御部に接続された複数の入出力装置と、を備え、

前記主制御部及び前記払出制御部は、接続中継部を介して試験装置に接続可能であり、

前記接続中継部は、

前記主制御部から出力される試験信号の一部がデータライン及びチップセレクトラインを介して複数のバッファ回路に入力し、

前記チップセレクトラインにより前記バッファ回路の第 1 バッファ回路に入力された試験信号によって複数のゲート回路の中からゲート回路を選択し、

前記データラインを介して前記バッファ回路の第 2 バッファ回路に試験信号を入力させ

、

前記第 1 バッファ回路から出力されたチップセレクト信号により選択されたゲート回路から前記試験装置に試験信号を出力させ、

前記チップセレクトラインは、前記主制御部のアドレスバスの一部と、チップセレクト端子から構成され、

前記接続中継部は、前記チップセレクトラインから入力された制御信号により、複数の前記ゲート回路から試験信号を出力するゲート回路を選択するためのチップセクタを有し、

前記データライン及び前記チップセレクトラインは、前記主制御部の外部バスインタフェースに接続され、

前記データラインは、前記外部バスインタフェースのデータラインに接続され、

前記チップセレクトラインは、前記外部バスインタフェースのアドレスラインに接続されることが可能であり、

前記第 2 バッファ回路は、複数の入力端子を有し、

前記第 2 バッファ回路の入力端子には、フィルタ回路が接続されている

ことを特徴とする遊技機。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0002
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正3】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0003
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0003】

従来、中継基板を介して主制御基板を試験装置に接続可能な遊技機が特許文献1に提案されている（例えば、特許文献1参照）。

【手続補正4】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0004
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0004】
【特許文献1】特開2003-210796号公報

【手続補正5】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0005
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0005】

上述したような従来遊技機のように、遊技機と試験装置とを接続する場合、中継基板を介して接続するのが一般的だが、遊技性等の遊技機の仕様に応じた中継基板を用意する必要がある。

【手続補正6】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0006
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0006】

本発明は、遊技機の仕様が変わったとしても、中継基板を変更することなく、また、最低限の変更により試験装置と接続することが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【手続補正7】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0007
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0007】

本発明に係る遊技機は、
主制御部（主制御回路6100）と、
前記主制御部に接続された払出制御部（払出・発射制御回路6300）と、
前記主制御部又は前記払出制御部に接続された複数の入出力装置（各種スイッチ類、各種ソレノイド類等）と、を備え、

前記主制御部及び前記払出制御部は、接続中継部（試験中継端子板7001）を介して試験装置に接続可能であり、

前記接続中継部は、

前記主制御部から出力される試験信号の一部がデータライン及びチップセレクトラインを介して複数のバッファ回路（試験中継端子板 7 0 0 1 の B U F 1、2）に入力し、

前記チップセレクトラインにより前記バッファ回路の第 1 バッファ回路（試験中継端子板 7 0 0 1 の B U F 2）に入力された試験信号によって複数のゲート回路（試験中継端子板 7 0 0 1 の G A T E 1 ～ 6）の中からゲート回路を選択し、

前記データラインを介して前記バッファ回路の第 2 バッファ回路（試験中継端子板 7 0 0 1 の B U F 1）に試験信号を入力させ、

前記第 1 バッファ回路から出力されたチップセレクト信号により選択されたゲート回路から前記試験装置に試験信号を出力させ、

前記チップセレクトラインは、前記主制御部のアドレスバスの一部と、チップセレクト端子から構成され、

前記接続中継部は、前記チップセレクトラインから入力された制御信号により、複数の前記ゲート回路から試験信号を出力するゲート回路を選択するためのチップセクタ（チップセクタ C S）を有し、

前記データライン及び前記チップセレクトラインは、前記主制御部の外部バスインタフェースに接続され、

前記データラインは、前記外部バスインタフェースのデータラインに接続され、

前記チップセレクトラインは、前記外部バスインタフェースのアドレスラインに接続されることが可能であり、

前記第 2 バッファ回路は、複数の入力端子（A 1 ～ A 8）を有し、

前記第 2 バッファ回路の入力端子には、フィルタ回路（フィルタ R C）が接続されている

構成を有している。

【**手続補正 8**】

【**補正対象書類名**】明細書

【**補正対象項目名**】0 0 0 8

【**補正方法**】変更

【**補正の内容**】

【**0 0 0 8**】

本発明は、遊技機の仕様が変わったとしても、中継基板を変更することなく、また、最低限の変更により試験装置と接続することが可能な遊技機を提供することができる。